

Контактные явления в полупроводниковой электронике

Сибирмовский Ю.Д., к.ф.-м.н., ассистент Института нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике НИЯУ МИФИ автор курса Гладков В.П.,к.т.н., доцент ИНТЭЛ НИЯУ МИФИ

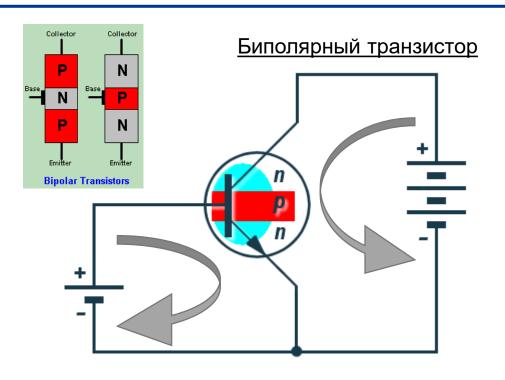
Полупроводниковая электроника



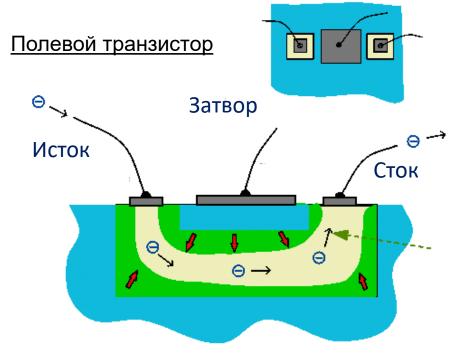




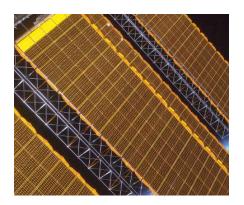
Фотодиоды и светодиоды













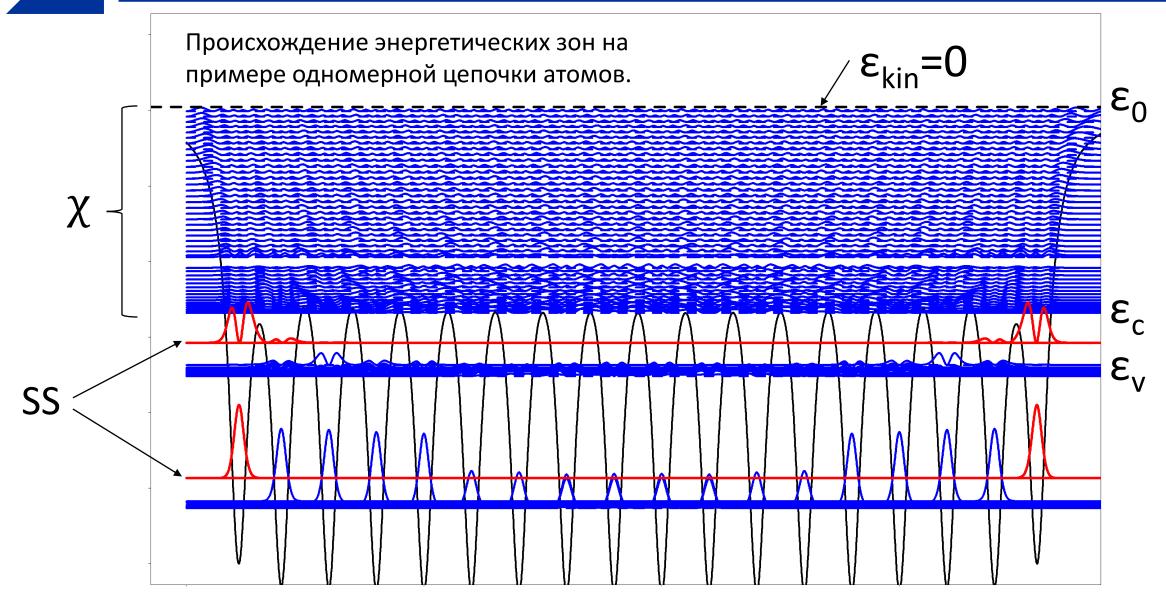
Структура доклада



- 1. Электроны в кристаллах. Энергетические зоны. Уровень вакуума. Электронное сродство. Поверхностные состояния.
- 2. Закон дисперсии и эффективная масса. Зоны Бриллюэна. Плотность состояний. Распределение Ферми.
- 3. Металлы и полупроводники. Электроны проводимости и дырки. Вырожденный и невырожденный электронный газ.
- 4. Легирование полупроводников. Основные и неосновные носители. Условие электронейтральности.
- 5. Диффузия и дрейф носителей заряда. Туннельный эффект. Самосогласованный потенциал.
- 6. Работа выхода. Термоэлектронная эмиссия.
- 7. Установление равновесия между двумя телами. Контактная разность потенциалов. Построение диаграмм контактов.
- 8. Контакт металл-диэлектрик-металл. Вольт-амперная характеристика. Учет туннелирования.
- 9. р-п переход. Туннельный диод.
- 10. Контакт металл-полупроводник. Барьер Шоттки. Омический контакт.
- 11. Гетеропереходы.

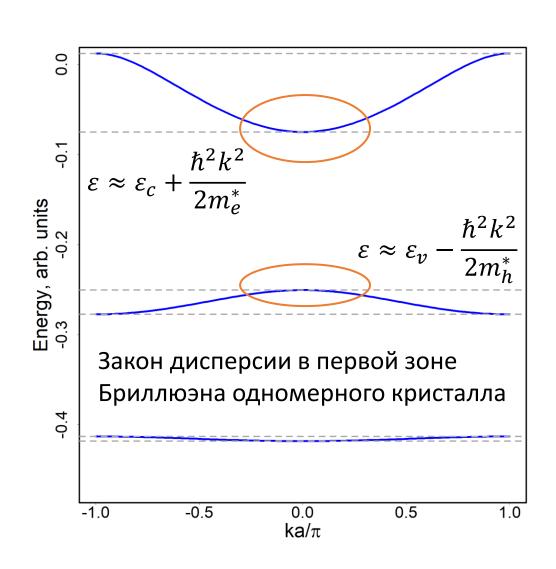
Электроны в кристаллах

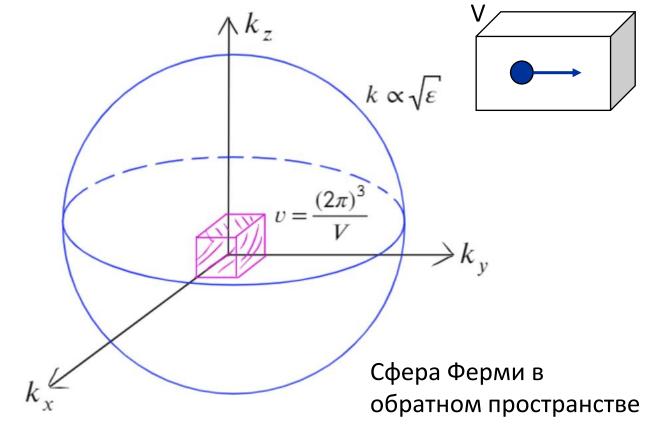




Закон дисперсии и плотность состояний





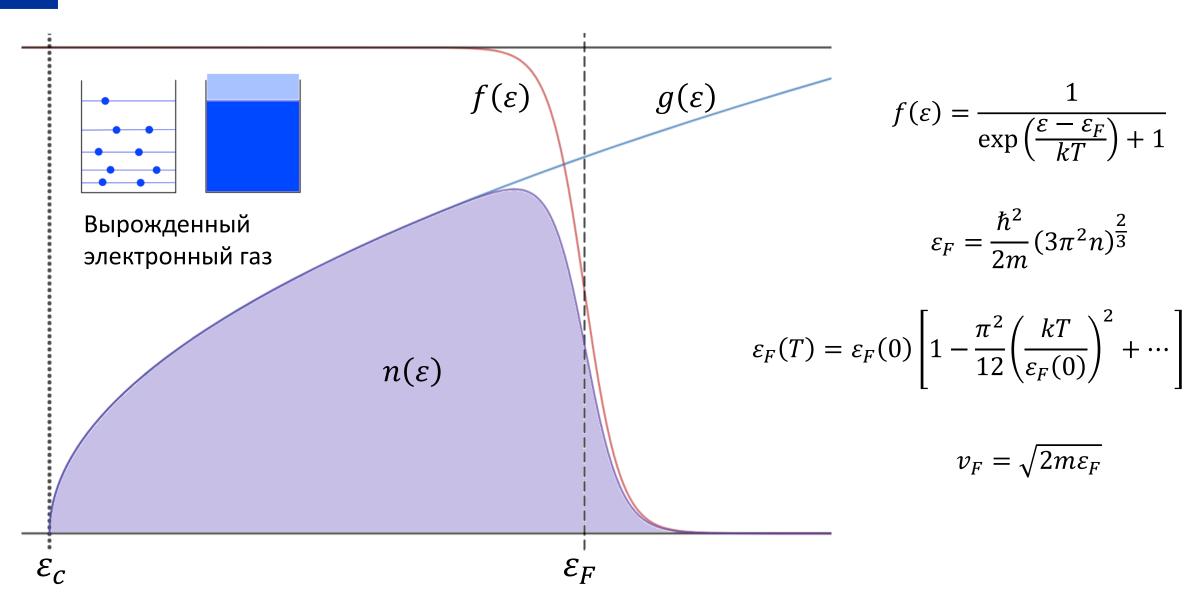


Плотность состояний:

$$\frac{g_n(\varepsilon)}{V} = \frac{dN}{Vd\varepsilon} = \frac{\sqrt{2}}{2\pi^2} \left(\frac{m_e^*}{\hbar^2}\right)^{3/2} \sqrt{\varepsilon - \varepsilon_c}$$

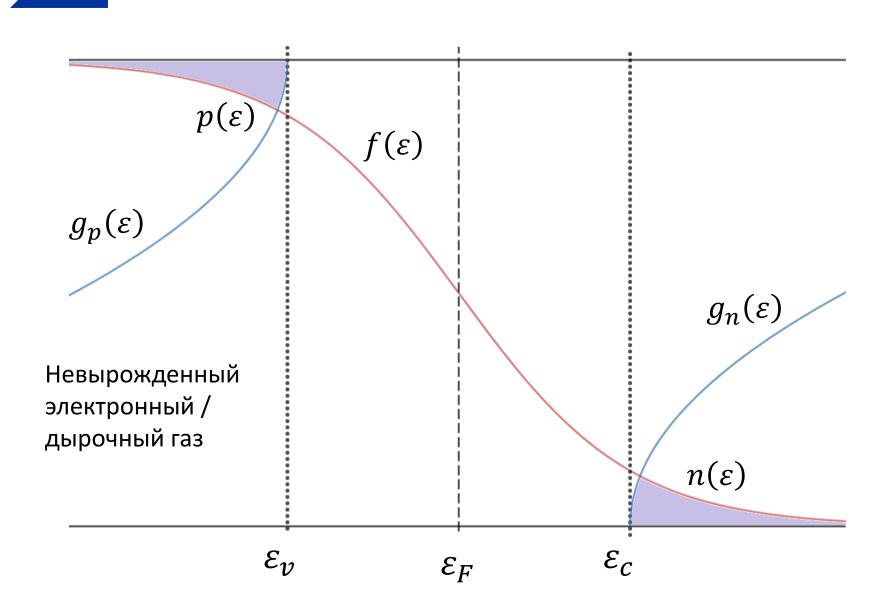
Металлы





Собственные полупроводники





$$f(\varepsilon) = \frac{1}{\exp\left(\frac{\varepsilon - \varepsilon_F}{kT}\right) + 1}$$

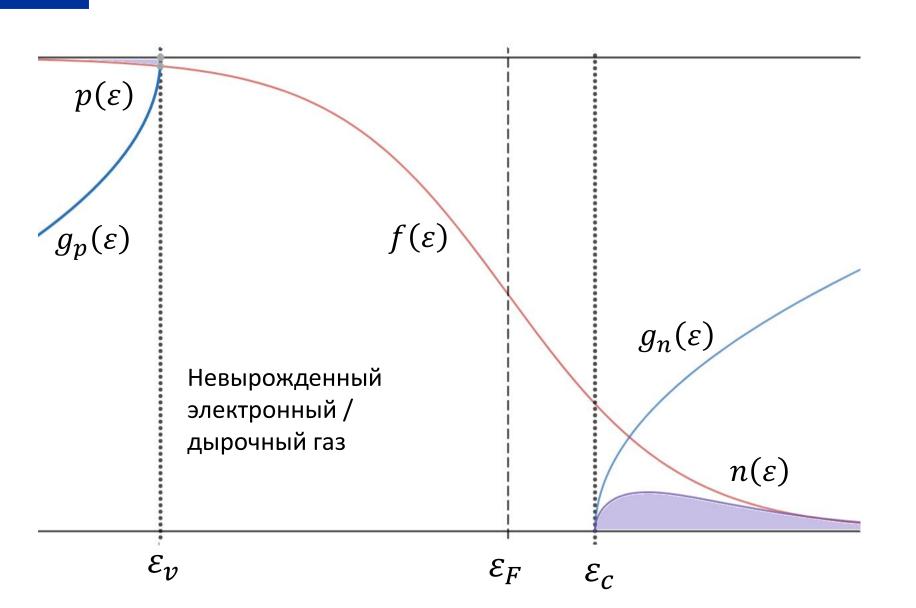
$$\varepsilon_F(T) = \frac{\varepsilon_c + \varepsilon_v}{2} + \frac{3}{4}kT \ln \frac{m_h^*}{m_e^*}$$

Условие электронейтральности:

$$n = p$$

Легированные полупроводники





$$f(\varepsilon) = \frac{1}{\exp\left(\frac{\varepsilon - \varepsilon_F}{kT}\right) + 1}$$

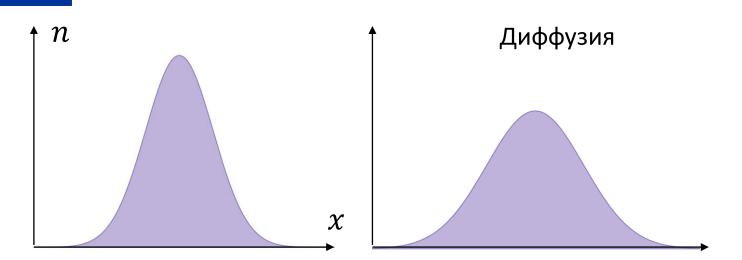
$$\varepsilon_F(T) \approx \varepsilon_c - kT \ln \frac{N_c}{N_D}$$

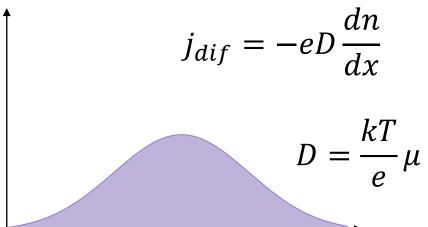
Условие электронейтральности:

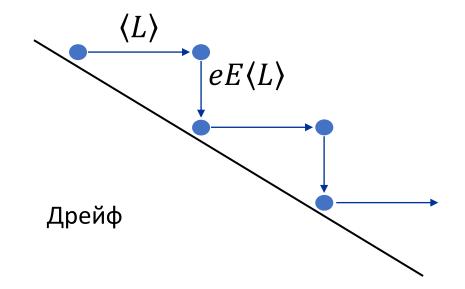
$$n = N_D + p$$

Диффузия и дрейф носителей заряда





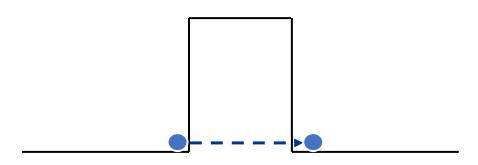




$$j_{dr} = en\mu E$$

$$\mu = \frac{e\langle L \rangle}{m^* v_T}$$

Туннелирование



Самосогласованный потенциал



Система уравнений диффузии-дрейфа

$$j = en\mu E - kT\mu \frac{dn}{dx} = 0$$

$$\int \frac{dn}{dx} = \frac{e}{kT} (E + E_{ext}) n$$

$$\frac{dE}{dx} = \frac{e}{\varepsilon_0 \varepsilon} (n - N_D)$$

$$\frac{dE}{dx} = \frac{e}{\varepsilon_0 \varepsilon} (n - N_D)$$

Потенциал

$$E + E_{ext} = -\frac{d\varphi}{dx}$$

Система уравнений Шредингера-Пуассона (двумерный электронный газ)

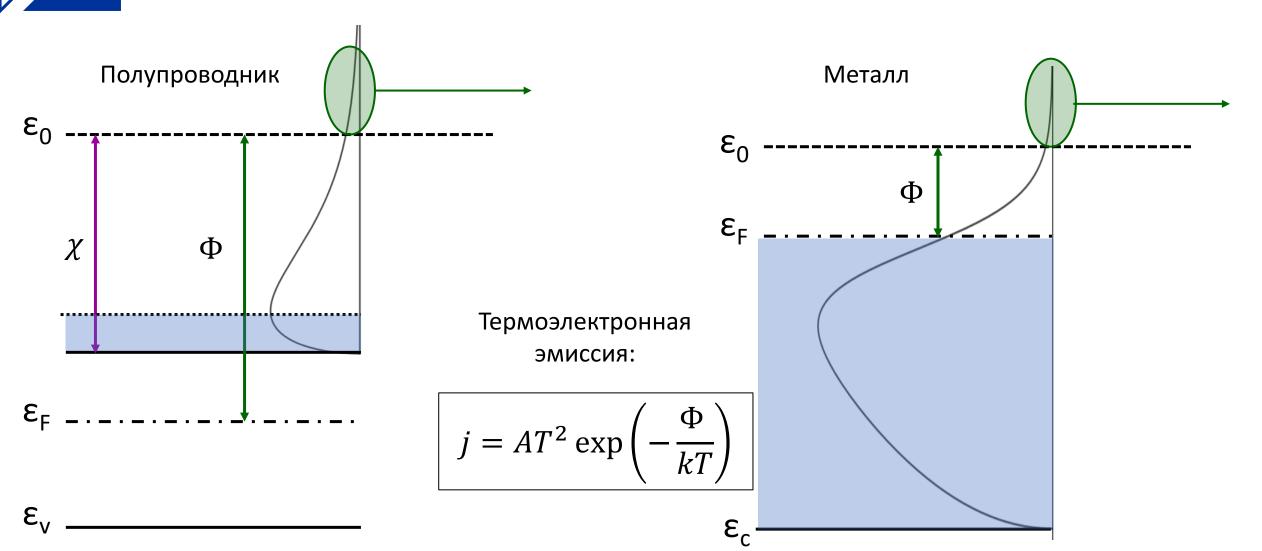
$$\int -\frac{\hbar^2}{2m^*} \frac{d^2\psi}{dx^2} + (e\varphi + U)\psi = \mathcal{E}\psi$$
$$\frac{d^2\varphi}{dx^2} = -\frac{e}{\varepsilon_0 \varepsilon} (n_s |\psi|^2 - N_D)$$

Нестационарные процессы – уравнение непрерывности.

$$e\frac{\partial n}{\partial t} + \frac{\partial j}{\partial x} = e(G - R)$$

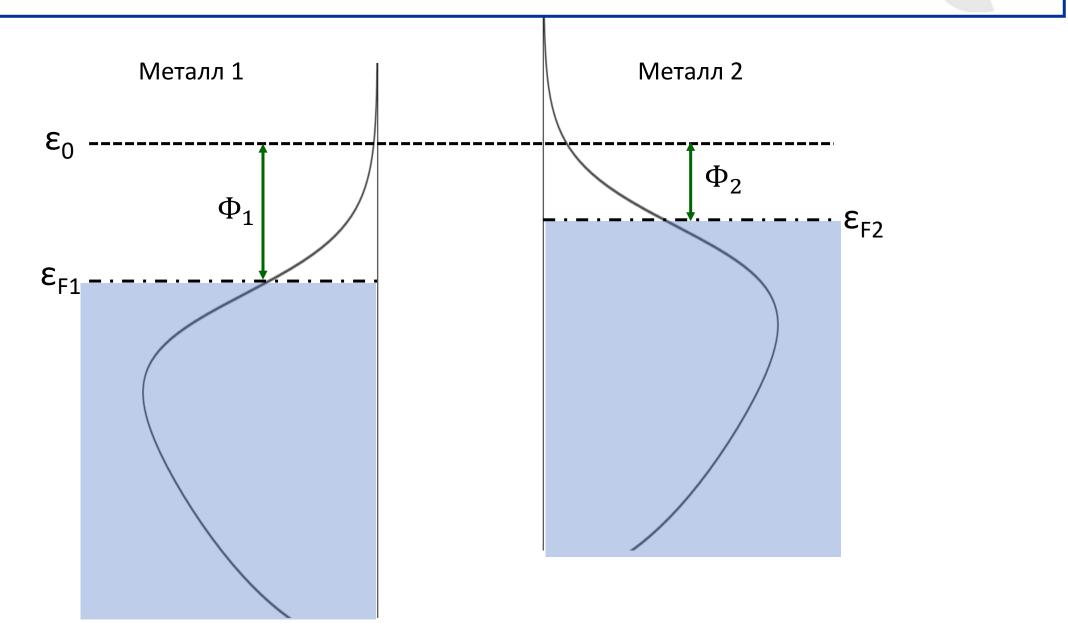
Эмиссия электронов и работа выхода





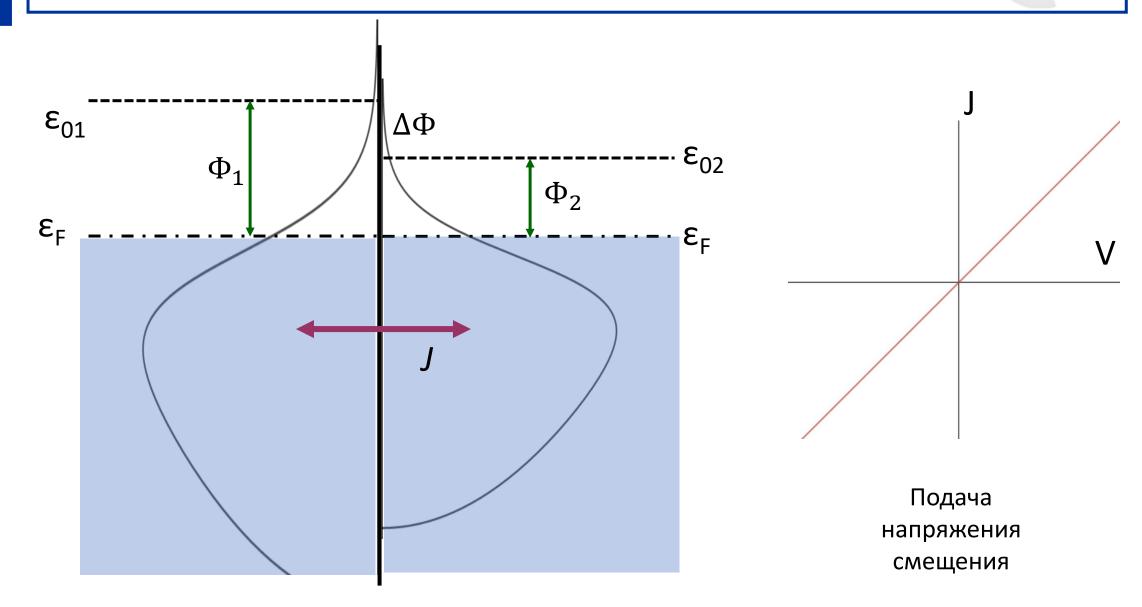
Контакт металл-металл



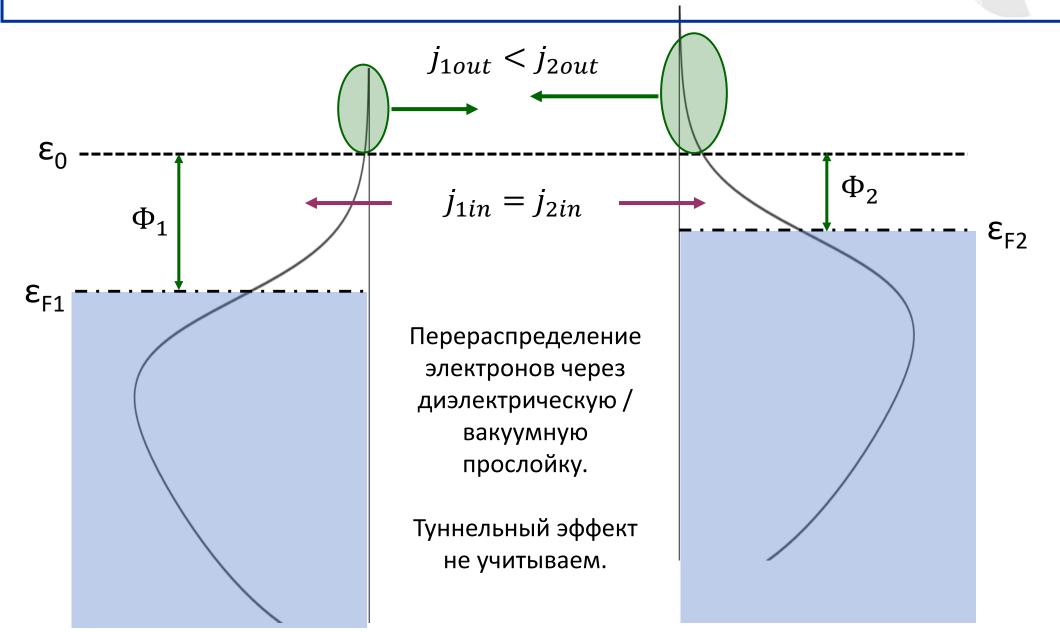


Контакт металл-металл

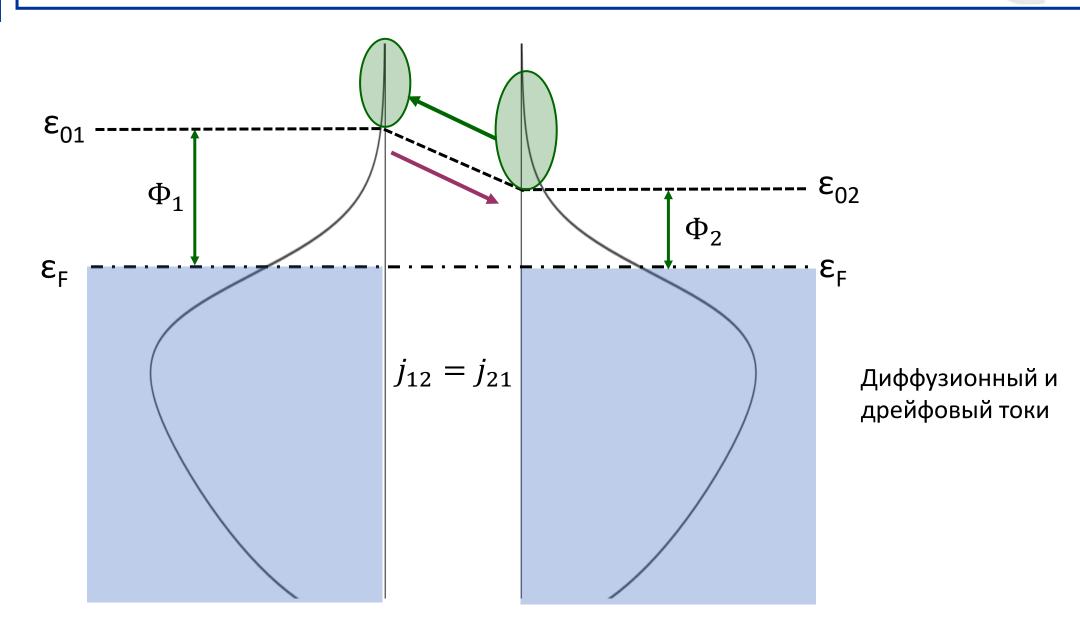




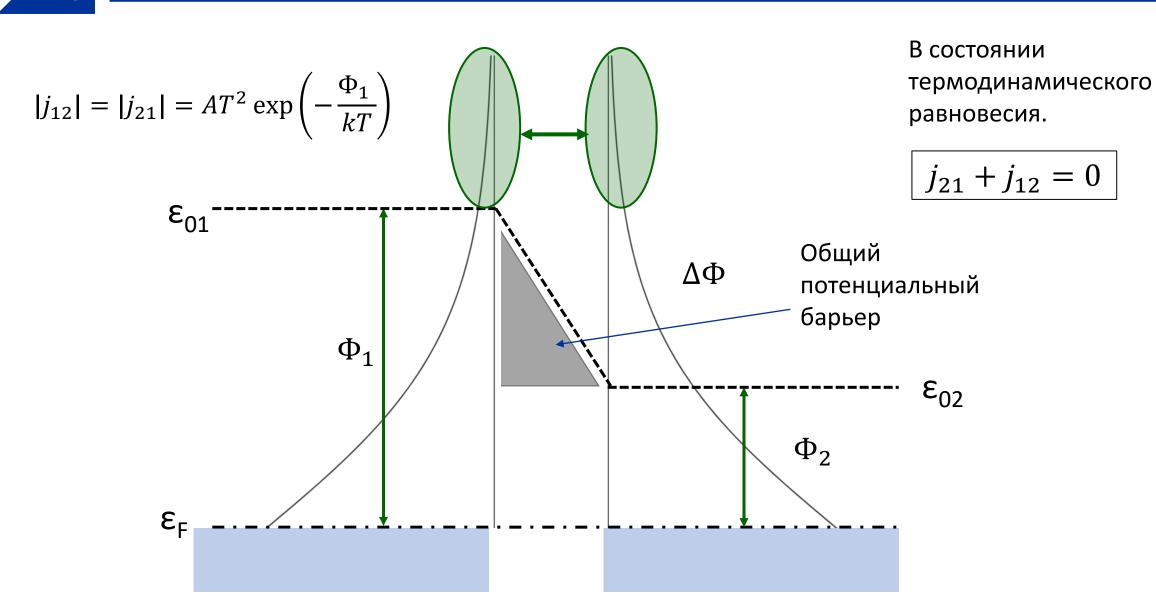




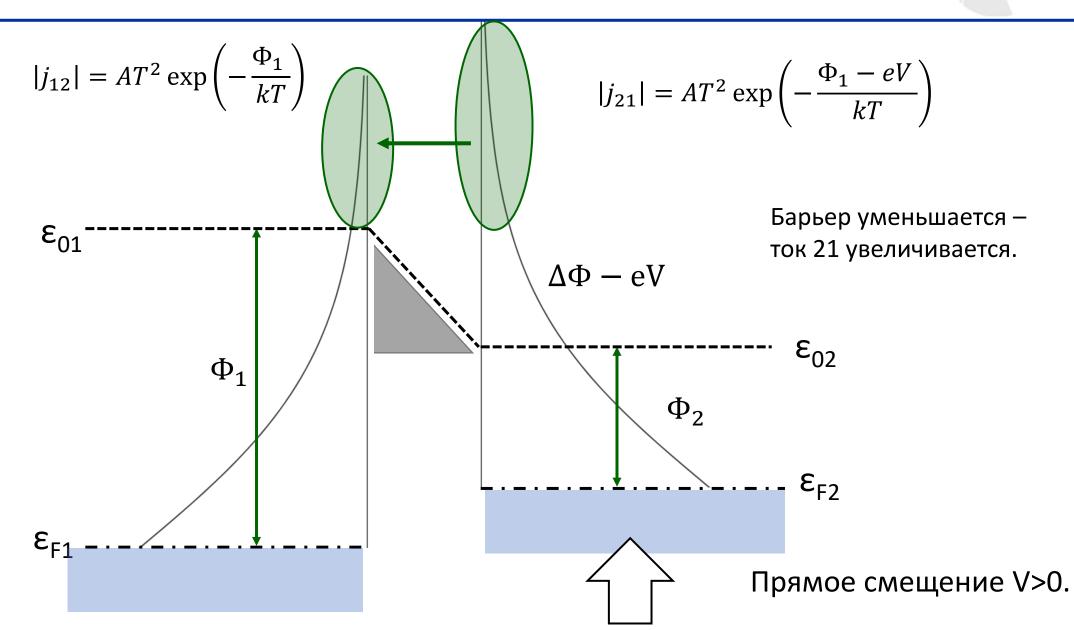






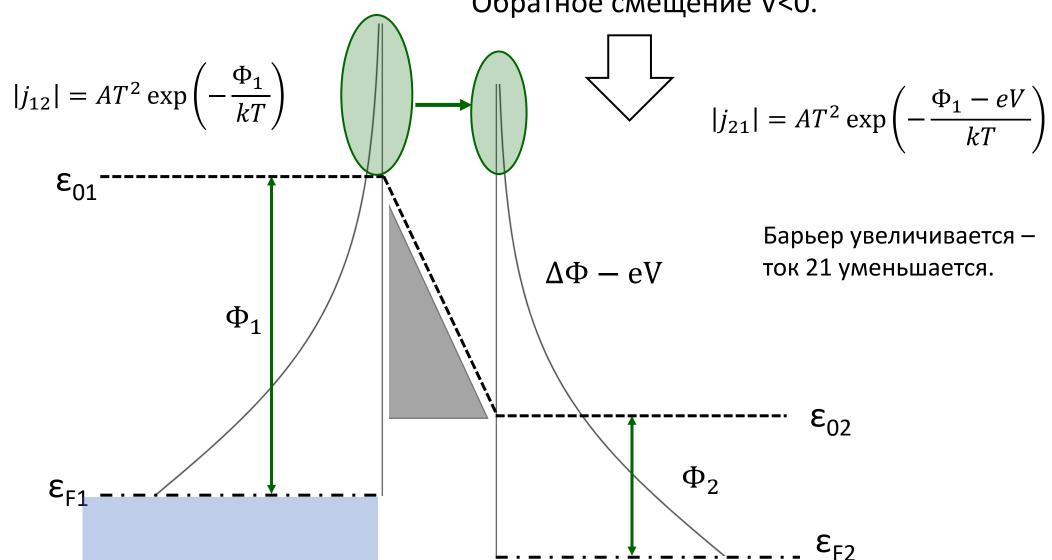












МДМ-диод



$$J(V) = J_0 \exp\left(-\frac{\Phi_1}{kT}\right) \left[\exp\left(\frac{eV}{kT}\right) - 1\right]$$

Обратная ветвь

$$-1 + \exp\left(-\frac{e|V|}{kT}\right)$$

Прямая ветвь

$$0 < eV < \Delta\Phi$$

$$\exp\left(\frac{e|V|}{kT}\right) - 1$$

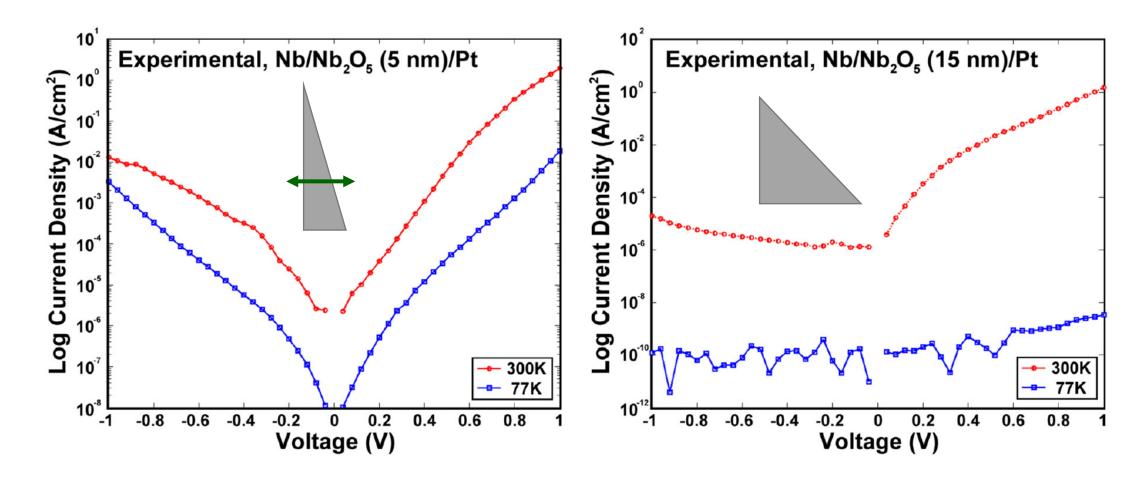
V

МДМ-диоды



Влияние туннельного эффекта.

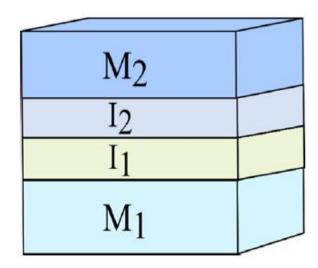
Chin et al.: Planar MIM diodes based on the Nb/Nb₂O₅/X material system



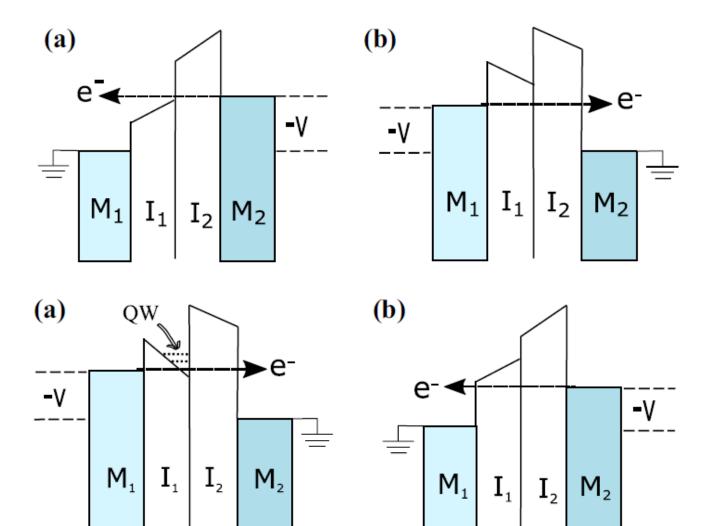
МДМ-диоды



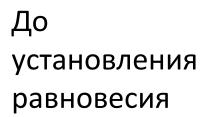
Два диэлектрика.

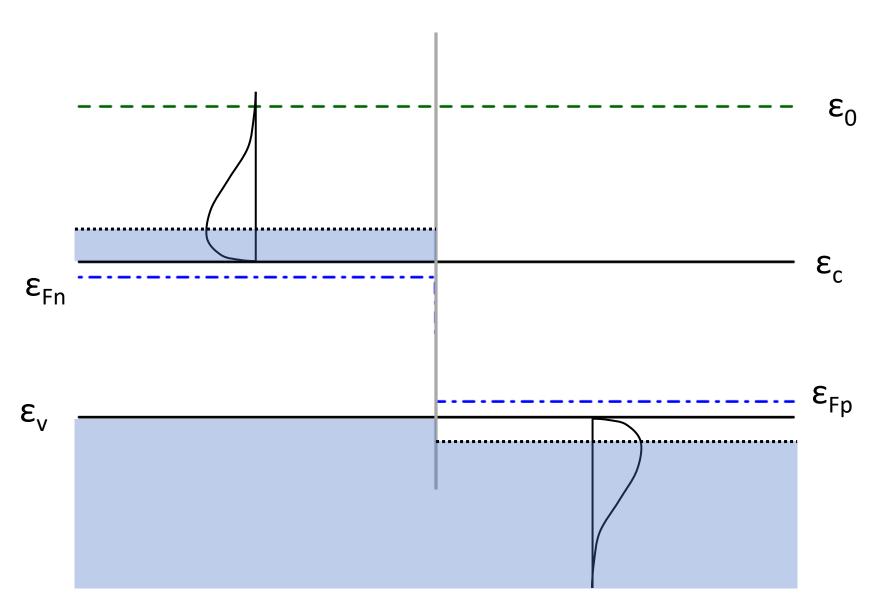


Shriwastava and Tripathi. Journal of ELECTRONIC MATERIALS, Vol. 48, No. 5, 2019



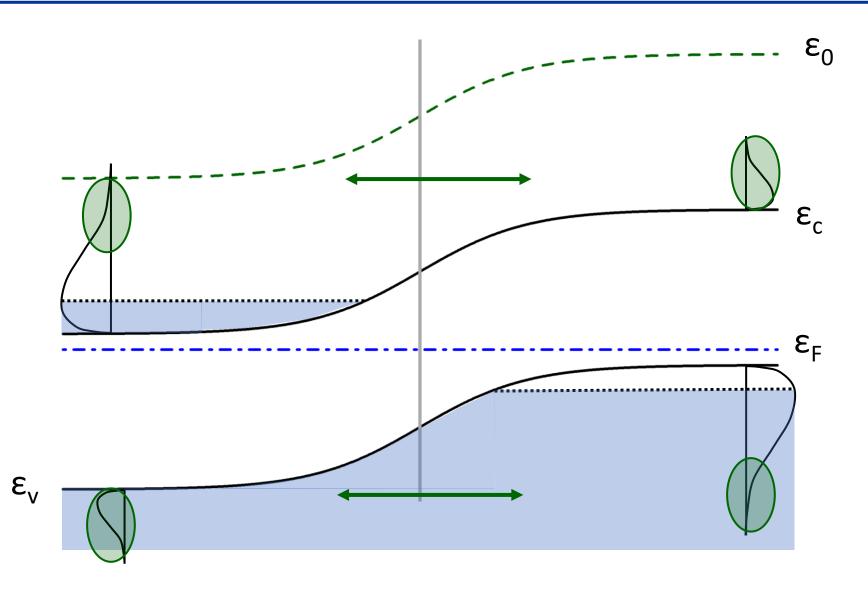








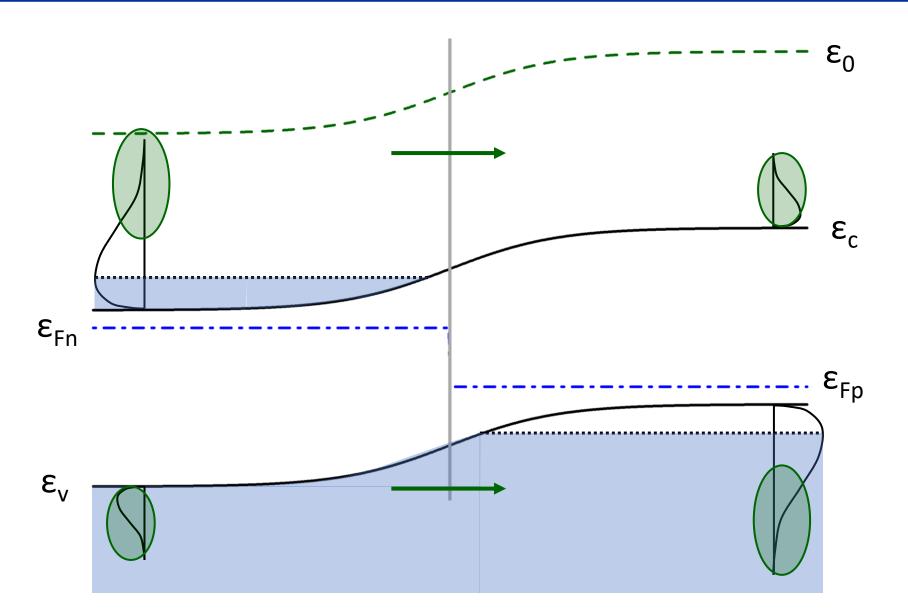
После установления равновесия





Прямое смещение V>0

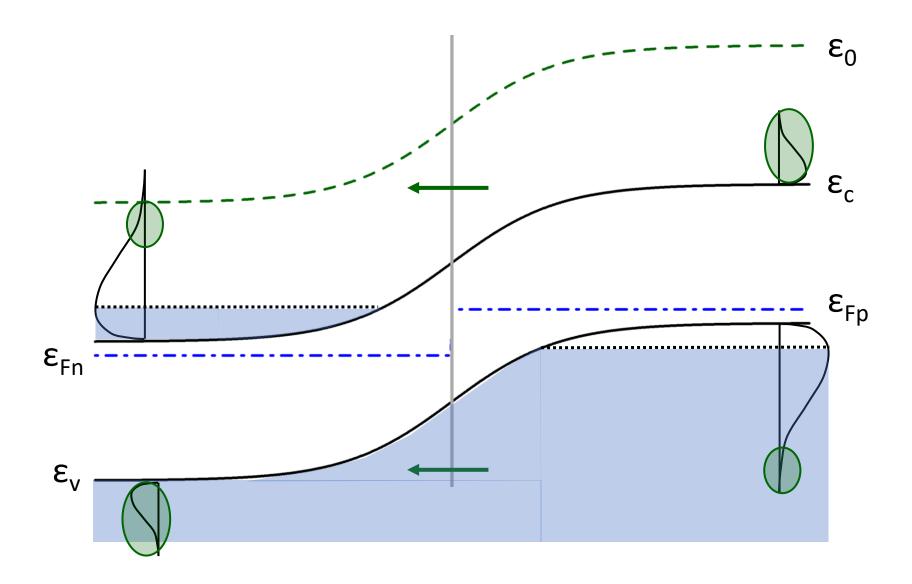
Барьер уменьшается ток слева направо увеличивается.





Обратное смещение V<0

Барьер увеличивается – ток слева направо уменьшается.



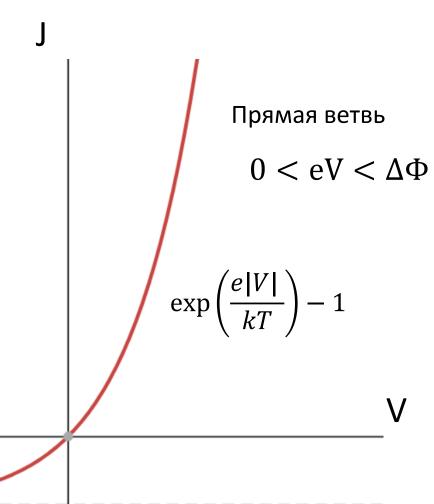
р-п диод



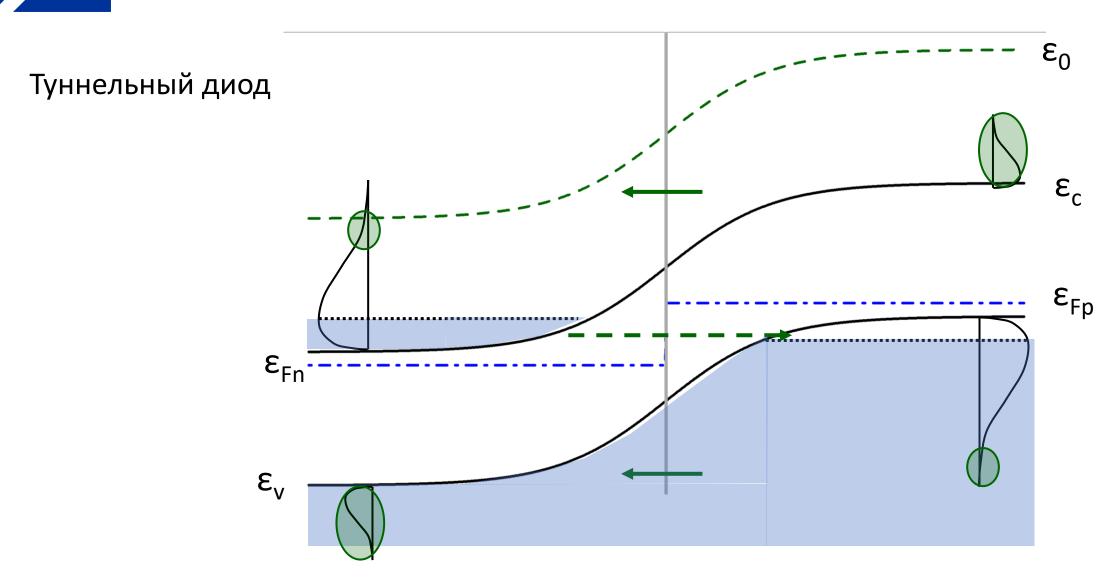
$$J(V) = J_0 \left[\exp\left(\frac{eV}{kT}\right) - 1 \right]$$

Обратная ветвь

$$-1 + \exp\left(-\frac{e|V|}{kT}\right)$$







Туннельный диод



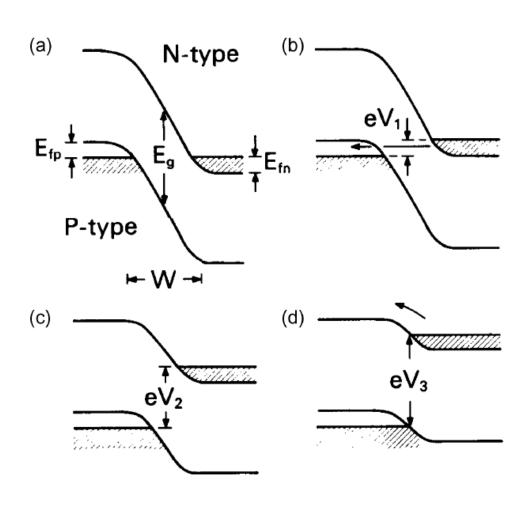
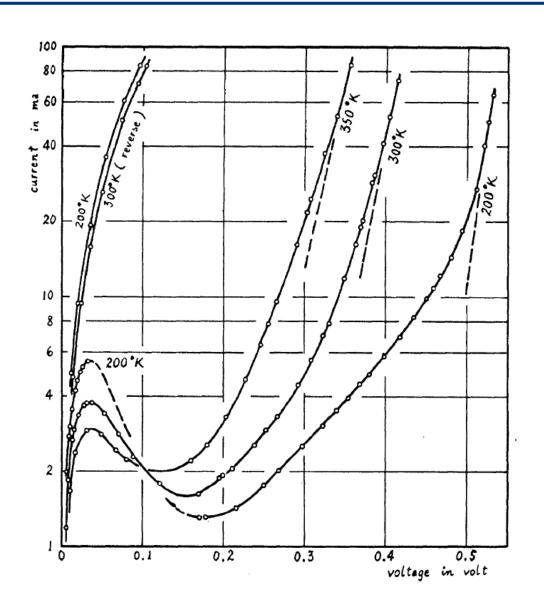
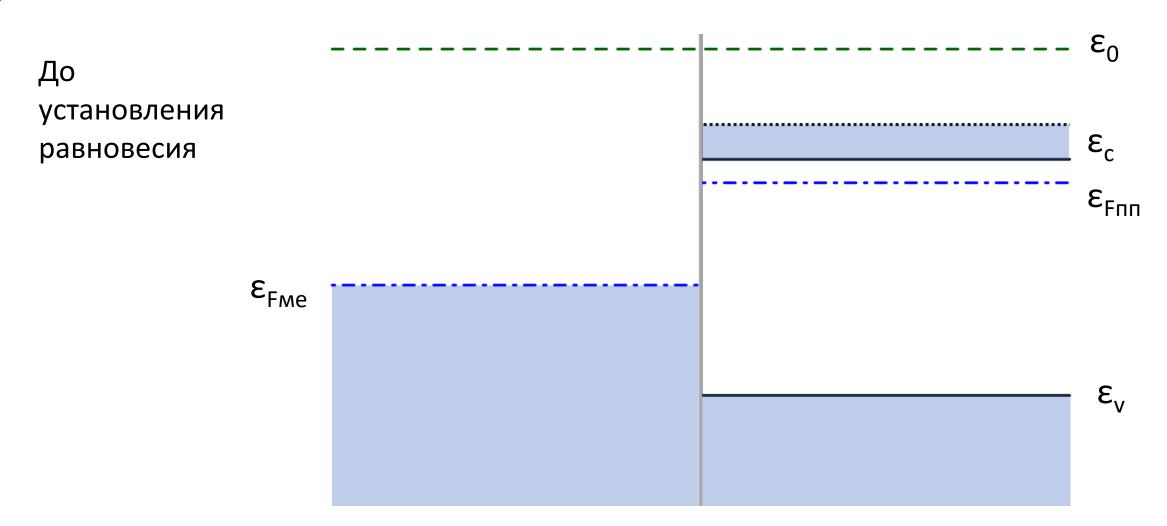


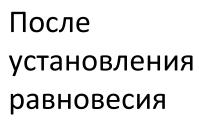
Fig. 14. Esaki's energy diagrams at varying bias conditions in the tunnel diode [28], copyright (2014) by the American Physical Society.

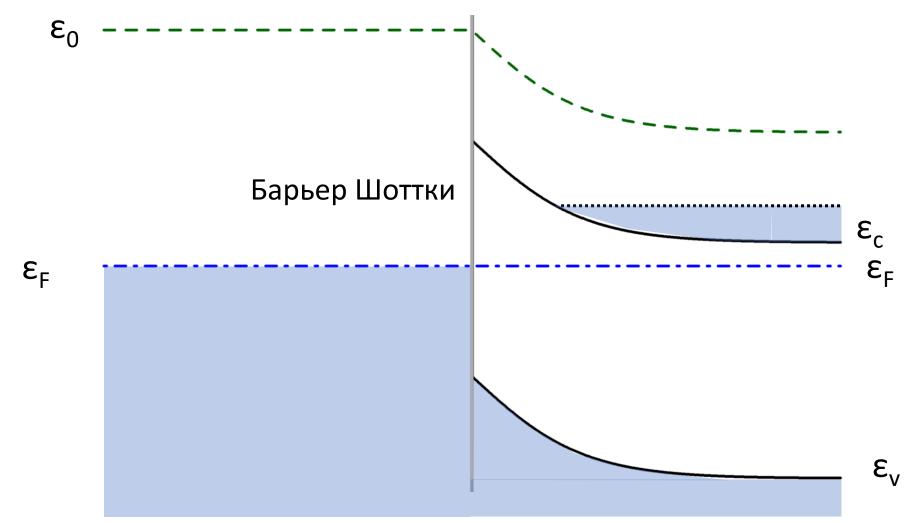




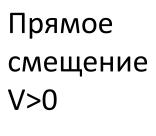




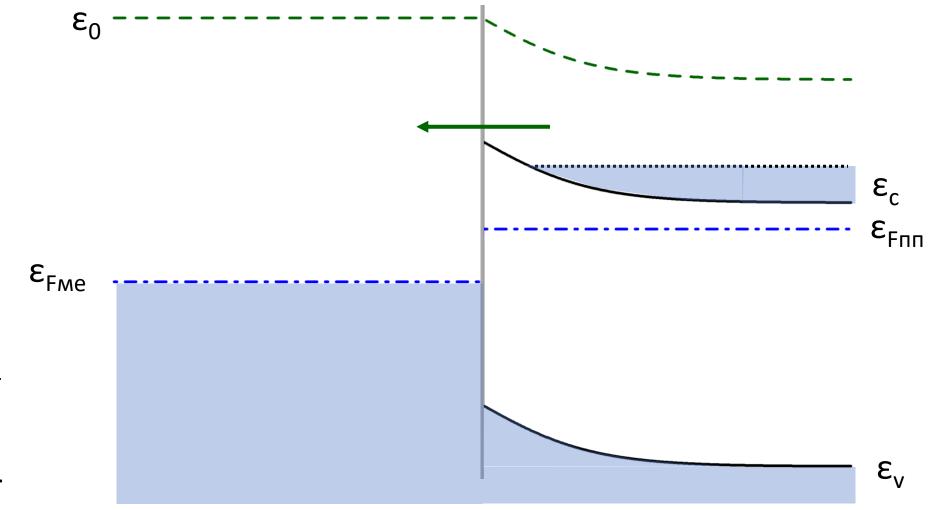




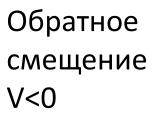




Барьер уменьшается ток справа налево увеличивается.

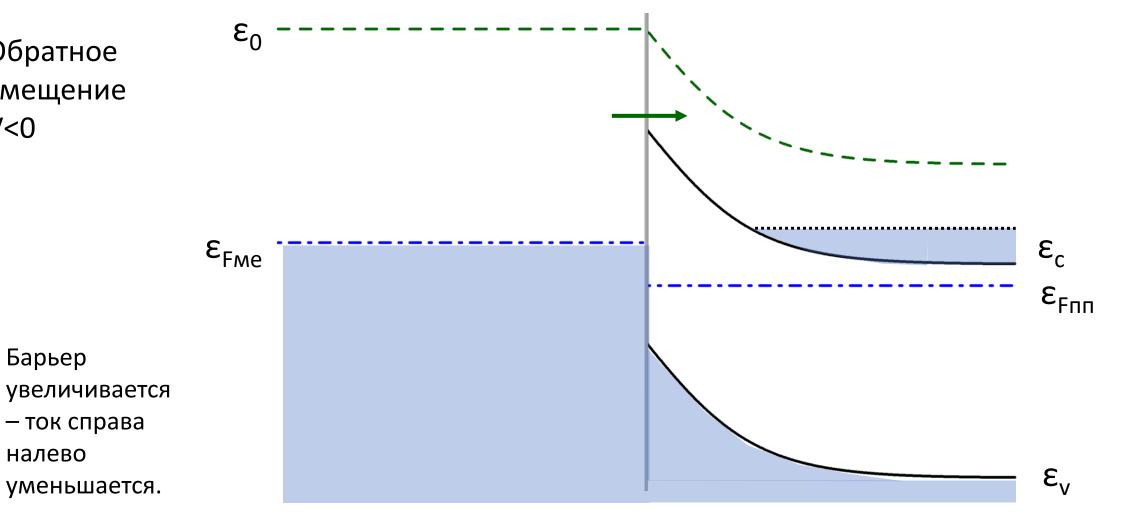






Барьер

налево



Диод Шоттки



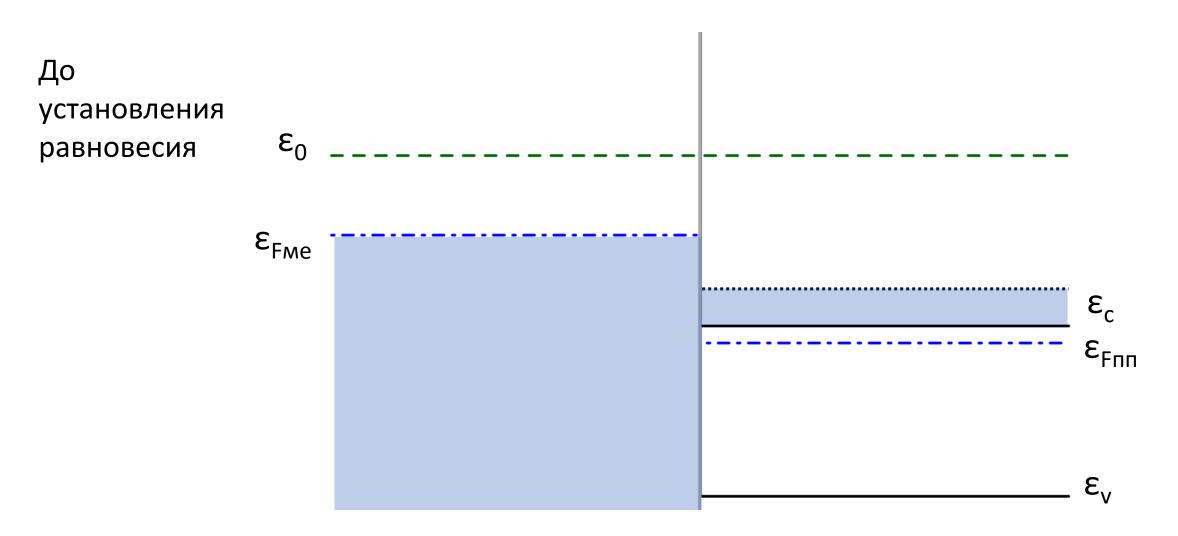
$$J(V) = J_0 \left[\exp\left(\frac{eV}{kT}\right) - 1 \right]$$

Обратная ветвь

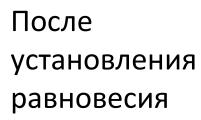
$$-1 + \exp\left(-\frac{e|V|}{kT}\right)$$

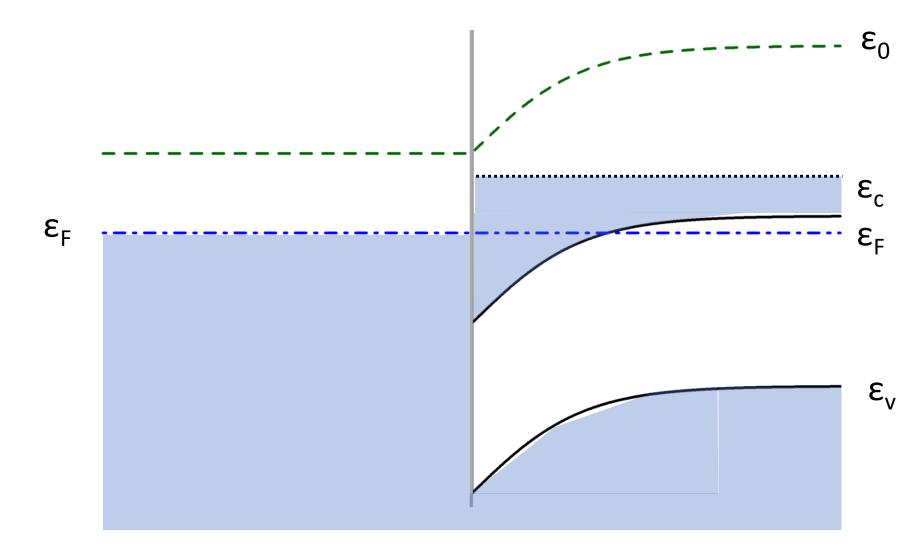
Прямая ветвь $0 < eV < \Delta \Phi$ $\exp\left(\frac{e|V|}{kT}\right) - 1$





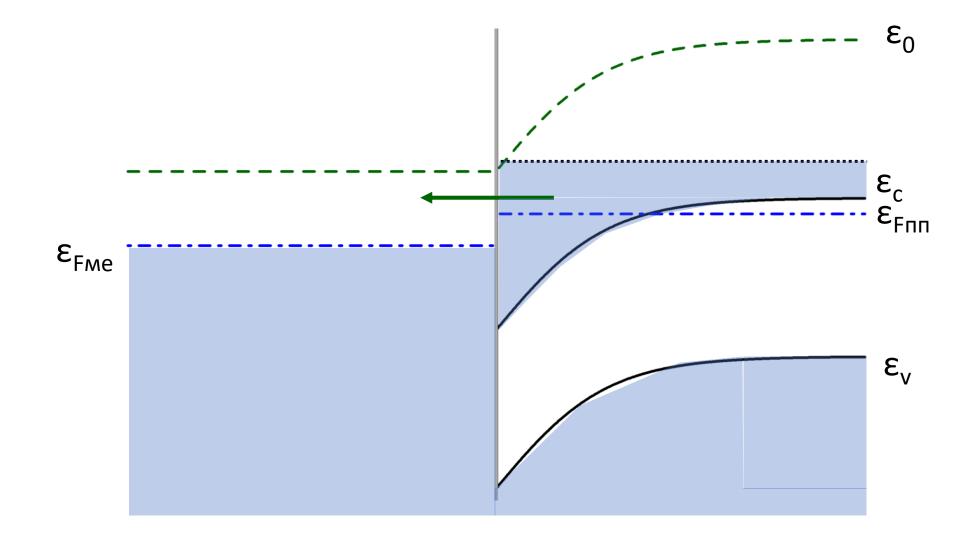






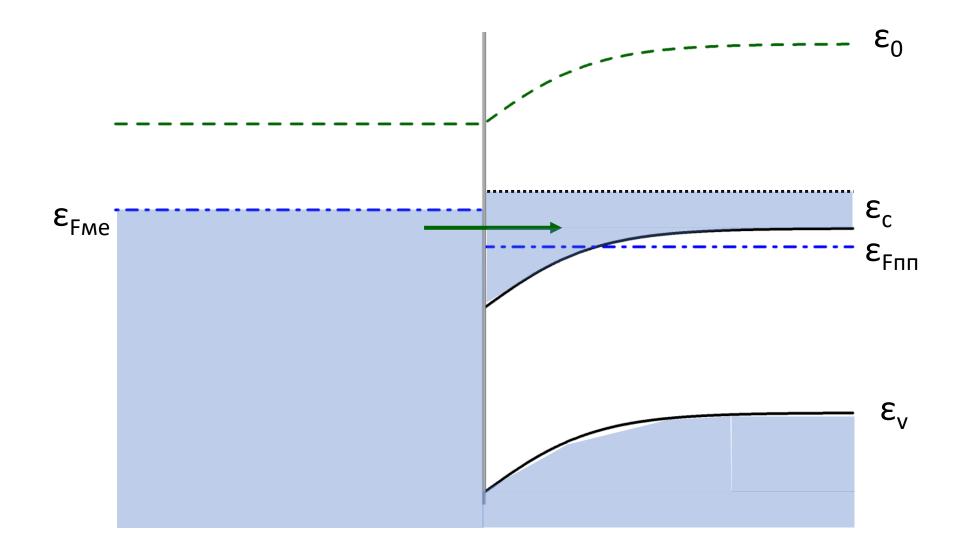


Прямое смещение V>0



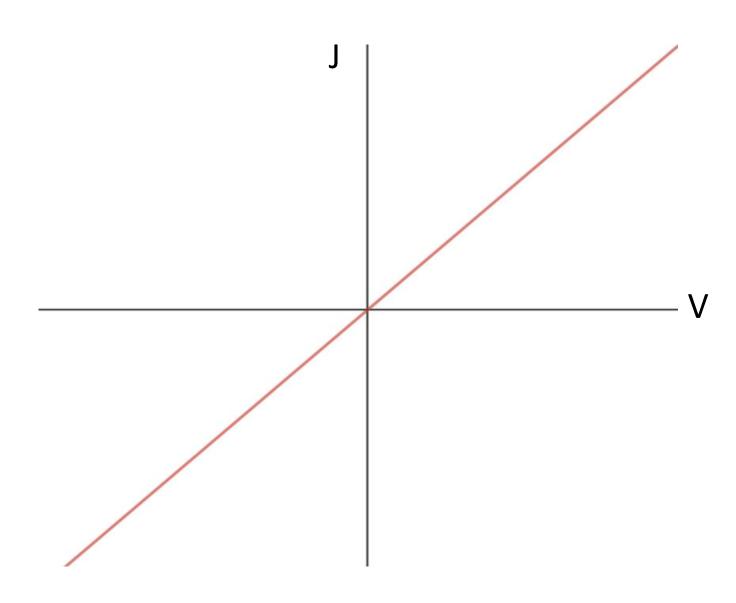


Обратное смещение V<0



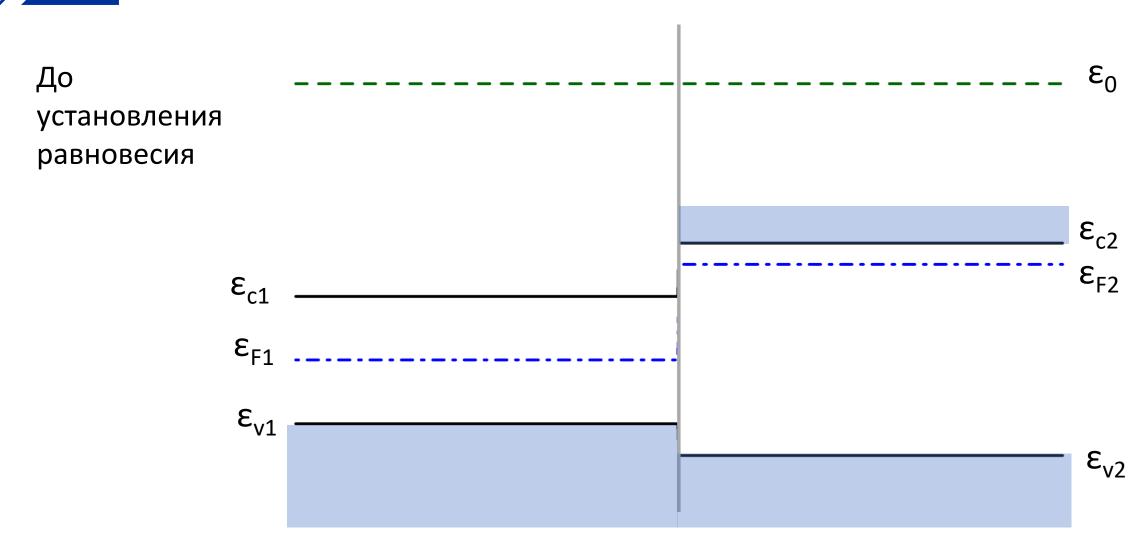
Омический контакт





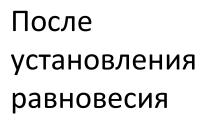
Гетеропереход

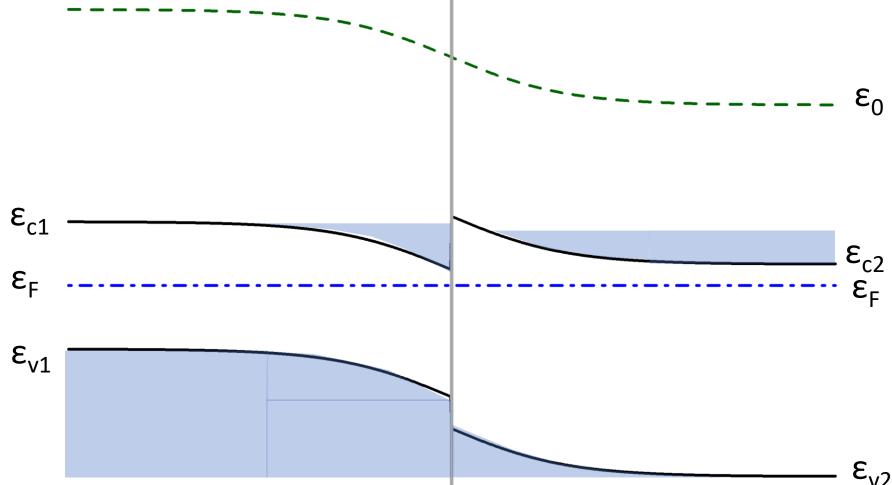




Гетеропереход









Спасибо за внимание